

計測分析に関する講演会

「赤外分光法・ラマン分光法による工業製品の分析」

～薄膜から異物分析まで～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:公益財団法人科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センターでは、高度計測分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の新技術・新製品開発への取組や現場の課題解決を支援しています。

このたび、新製品開発や品質保証に際してご相談の多い「赤外分光法・ラマン分光法による工業製品の分析」に焦点を当てた講演会を、平成28年9月8日(木)に開催します。

講演会では、赤外分光法・ラマン分光法を用いた発光ダイオード、トランジスタ、太陽電池などの有機半導体薄膜の構造に関する評価や自動車排ガスを浄化する触媒表面における吸着種の反応解析、また多層膜フィルムや異物の測定事例など工業製品を中心とした講演を行います。

講演後は、計測分析に関する個別の技術相談会や、当センターの計測分析機器及び隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会を行います。

参加費は無料です。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

【日 時】平成28年9月8日(木) 午後1時30分～午後4時45分

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

※会場には公共交通機関を利用してお越しください

【プログラム】

時間	内容
13:00 ～ 13:30	受付
13:30 ～ 13:35	開会あいさつ
13:35 ～ 14:35	講演1「赤外・ラマン分光法による有機半導体薄膜の評価」 講師:早稲田大学 先進理工学部 化学・生命化学科 教授 古川 行夫 氏
14:45 ～ 15:45	講演2「赤外分光法を中心としたガス、触媒、ポリマーの反応解析」 講師:(株)東レリサーチセンター 構造化学研究部 構造化学第1研究室 主任研究員 熊沢 亮一 氏
15:45 ～ 16:00	事例紹介「当センターにおける赤外・ラマン分光法の測定事例」 担当:あいち産業科学技術総合センター共同研究支援部 計測分析室 主任 山田 圭二
16:00 ～ 16:15	あいちシンクロトロン光センター紹介「シンクロトロン光による材料分析」 担当:公益財団法人科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター シンクロトロン光産業利用コーディネータ 東 博純 氏
16:15 ～ 16:45	技術相談会・見学会(希望者のみ) 高度計測分析機器、あいちシンクロトロン光センター

■ **申込方法** 下記の申込書に御記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成28年9月7日(水)

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名(先着順)

■ **交通の御案内**

- ・東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・猿投グリーンロード八草ICから西へ約800m

■ **申込み及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター

共同研究支援部 計測分析室 山田、船越、池口

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会（平成28年9月8日(木)）

参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 山田、船越、池口 宛

FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX メールアドレス
相談・見学会への参加 両方参加も可 (ご希望に○をつけて下さい。)	相談会参加 見学会参加 不参加
相談内容 (相談会参加希望の方は ご記入ください。)	

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。

あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」のメール配信を希望される方は、チェックしてください。